

BrukerAFM ミーティング2024

【テーマ】原子間力顕微鏡を用いた機械特性評価

ブルカーAFMユーザー様、AFMをご検討中のお客様を対象としてAFMミーティングを実施します。今回のテーマは機械特性になっており、ユーザー様による最新のご研究成果や、測定のための技術など、特に高分子をご研究の方々に役立つプログラムを企画しております。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

❖ 開催概要

日時：2024年3月12日（火） 13:00-17:30（12:30 受付開始）

会場：アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501号室

(https://abc-kaigishitsu.com/tokyo_yaesudori/yaesudori.html)

〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 八重洲通ハタビル5階

JR東京駅（八重洲口）より徒歩約10分、日比谷線 八丁堀駅より徒歩2分。

定員：60名

費用：無料（事前登録制）

申込み：左記登録サイトよりお申し込み下さい

登録フォーム ▶ <https://bit.ly/48kMWek>

▼登録フォーム



❖ プログラム

開始	終了	内容	講演者
12:55	13:00	開催のご挨拶	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 統括部長 鈴木 大輔
13:00	13:30	『原子間力顕微鏡によるフィラー充填ゴムのナノ応力分布とナノ導電性の最新研究』	東京工業大学 物質理工学院 応用化学系 助教 梁 暁斌様
13:30	13:50	『化粧品開発でのAFM活用事例』	株式会社資生堂 シーズ開発センター 分析技術G 高橋 洋平様
14:00	14:30	『ウルトラマイクロトームによるAFM試料の作製』	ライカマイクロシステムズ(株) ライフサイエンス・リサーチ事業部 長澤 忠広様
14:30	14:50	『ブルカーAFMによる最新の機械特性評価』	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 アプリケーション部 横川 雅俊
15:00	15:30	休憩 簡単なお茶とお菓子を用意しております。 参加者の皆様での情報交換の機会としていただければ幸いです。	
15:30	16:20	座談会『みんなで話そう機械特性評価』 AFMを用いた機械特性評価の課題や期待をパネリストの方々と意見交換できるプログラムです。パネリストとしての参加の希望・ご質問・ご相談を登録フォームより承っております。	モデレータ:東京工業大学 中嶋 健先生 パネリスト:講演者、参加ご希望者
16:20	16:40	『ブルカー製品のご案内とお知らせ』	ブルカージャパン(株) ナノ表面計測事業部 営業部 荒尾 昌樹

※24年秋には電気特性をテーマとしたユーザーミーティングも企画中です。乞うご期待ください。



【お問合せ】

ブルカージャパン株式会社
ナノ表面計測事業部

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1
Tel:03-3523-6361 FAX:03-3523-6364

Email: Info-nano.BNS.JP@bruker.com
Web : www.bruker-nano.jp